

ОТЧЕТ
о достижении заданных значений программных индикаторов
на 3 этапе выполнения работ по государственному контракту
от «19» июня 2008 г № 02.552.11.7033
Шифр «2008-7-5.2-00-18-095»

Индикатор		Требование ТЗ			Дости гнуто к начал у этапа	Приращ ение на отчетно м этапе	Выполн ение нараста ющим итогом на конец отчетно го этапа
Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Значе ние	Срок достиже ния			
И5.2.1	количество публикаций в ведущих мировых научных журналах, подготовленных по результатам исследований с использованием научного оборудования сети центров	шт.	12	март 2009 г.	7	6	13
И5.2.2	количество дипломных работ и диссертаций, подготовленных по результатам исследований с использованием научного оборудования сети центров	шт.	7	март 2009 г.	3	4	7
И5.2.3	число организаций-пользователей научным оборудованием сети центров	шт.	15	март 2009 г.	13	8	21

Ректор МФТИ,
член-корр. РАН

Н.Н. Кудрявцев

_____ 2009 г.

М.П.

**Сведения по публикациям на 3 этапе выполнения работ по
государственному контракту
от «19» июня 2008 г № 02.552.11.7033
Шифр «2008-7-5.2-00-18-095»**

В ходе выполнения этапа № 3 были подготовлены следующие статьи (И5.2.1):

1. Астапенко В.А. Поляризационное тормозное излучение водородоподобного иона в монокристалле // ЖЭТФ, 2009, т. 135, вып. 1, стр.145-153.
2. V.A. Astapenko and M.S. Romadanovskii. Excitation of a Two-Level System by a Chirped Laser Pulse // Laser Physics, 2009, Vol. 19, No. 5.
3. P.N. Melentiev, A.V. Zablotskiy, D.A. Lapshin, E.P. Sheshin, A.S. Baturin, and V.I. Balykin. Nanolithography based on atom pinhole camera // Nature Nanotechnology, 2009 (принято в печать).
4. Ч.П. Волк, Ю.А. Новиков, А.В. Раков, П.А. Тодуа. Измерение линейных размеров рельефных элементов микро- и наноструктур на высоко- и низковольтных растровых электронных микроскопах // Измерительная техника, 2009, № 1, стр. 15-17.
5. V.P. Gavrilenko, M.N. Filippov, Yu.A. Novikov, Yu.V. Ozerin, A.V. Rakov, P.A. Todua, Ch.P. Volk. Calibration of a scanning electron microscope in the wide range of magnifications for the microscope operation in the line of integrated circuits production // Book of Abstracts “Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XXIII”, 2009, 7272-37.
6. V.P. Gavrilenko, V.A. Kalnov, Yu.A. Novikov, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, P.A. Todua, K.A. Valiev, E.N. Zhikharev. Measurement of dimensions of resist mask elements below 100 nm with help of a scanning electron microscope // Book of Abstracts “Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XXIII”, 2009, 7272-87.

**Сведения по дипломным работам и диссертациям, подготовленным на 3 этапе
выполнения работ по государственному контракту
от «19» июня 2008 г № 02.552.11.7033
Шифр «2008-7-5.2-00-18-095»**

В ходе выполнения этапа № 3 были подготовлены магистерские диссертации следующими студентами 6 курса МФТИ(И5.2.2):

1. Коростылев Евгений Владимирович – «Разработка методики исследования элементного состава тонких пленок с помощью рентгеновского микроанализа».
2. Новиков Роман Юрьевич – «Изучение электрических свойств поверхности полупроводников в различных газовых средах с помощью АСМ»
3. Нагирный Вячеслав Павлович – «Разработка концепции виртуального атомно-силового микроскопа для целей нанометрологии».
4. Шереверова Марина Александровна – «Создание нерезонансной динамической методики АСМ для исследования физических свойств поверхности».

Данные тематики дипломных работ были утверждены приказом по МФТИ № 431-4 от 16.03.2009 г. Согласно сложившейся практики защита дипломных работ будет осуществлена в начале июня 2009 года.

**Сведения по организациям-пользователям научным оборудованием ЦКП МФТИ
на 3 этапе выполнения работ по государственному контракту
от «19» июня 2008 г № 02.552.11.7033
Шифр «2008-7-5.2-00-18-095»**

По индикатору И5.2.3 следующие организации:

1. Институт радиотехники и электроники РАН.
2. ИНЭОС РАН.
3. ФГУ Российский Научно Центр «Курчатовский Институт».
4. Шлюмберже.
5. ИПТМ РАН.
6. НПП «Томилинский электронный завод».
7. ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, РОНЦ им. Н.Н.Блохина.
8. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет.